 Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/518,407	URANO ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Helen C. Kwok	2856	

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
	· · · · · ·	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

INTERFERENCE SEARCHED				
Subclass	Date	Examiner		
514.06	11/27/2007	нк		
514.09	11/27/2007	нк		
	Subclass 514.06	Subclass Date 514.06 11/27/2007		

SEARCH I (INCLUDING SEAR		')
	DATE	EXMR
Updated Previous Search	11/27/2007	нк